
Difractometru de raze X de inalta rezolutie si intensitate ridicata a fasciculului, dedicat pentru analiza si cartografierea structurii cristaline, texturii si macro-tensiunilor în filme subtiri si monocristale masive

I.D.: 21713713

Documente participare:

- 2-177966.zip

Data publicarii	11.08.17	Coduri CPV	38530000-9 51430000-5 80510000-2
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	21.09.17	Pretul estimativ:	1.890.756,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------------

Descriere: Furnizarea, instalarea si punerea in functiune cu instruirea personalului utilizator a unui Difractometru de raze X de inalta rezolutie si intensitate ridicata a fasciculului, dedicat pentru analiza si cartografierea structurii cristaline, texturii si macro-tensiunilor în filme subtiri si monocristale masive
